

О статистических свойствах последовательностей,
формируемых физически неклонируемыми
функциями, для использования в механизмах
идентификации и аутентификации

Бондаренко А.И., Маршалко Г.Б., Романенков Р.А., Уривский А.В.,
Щербакова А.О.

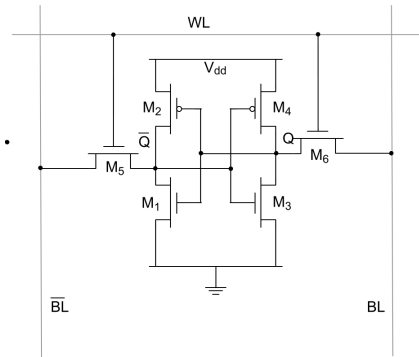
24 марта 2022 г.

Что такое физически неклонлируемая функция (ФНФ)?

- Это функция, такая что ее реализация на конкретном устройстве, существенным образом зависит от физических характеристик этого устройства, определяемых технологическими допусками процесса производства.
- При этом для конкретного устройства некоторые значения функции характеризуются определенной стабильностью, а для различных устройств для одних и тех же входных значений, в целом, различаются.
- Это позволяет использовать данный примитив как для задач идентификации, так и для выработки случайных чисел.

ФНФ на статической памяти с произвольным доступом (SRAM)

- SRAM - энергозависимая память с произвольным доступом.
- Каждая ячейка памяти имеет свое вероятное состояние при включении.
- ФНФ типа SRAM считывает дампы памяти, которые определяют значение функции для каждого устройства.



Модель

Будем моделировать ФНФ как семейство \mathbb{A} вероятностных автоматов $\mathcal{A}_i = (C, S, X, P_{I,E}, \xi_{I,E})$, где C, S, X – входное множество, множество внутренних состояний, выходное множество $P_{I,E} : C \times S \rightarrow S \times X$ – функция поведения ФНФ, $\xi_{I,E}$ – начальное распределение на S .

Параметризация

- I – внутренние параметры (технологические допуски)
- E – внешние параметры (температура, влажность, напряжение)

ФНФ типа SRAM

$C = \emptyset$, $P_{I,E}(s) = (s, s)$, $s \in S$. То есть поведение ФНФ описывается распределением $\xi_{I,E}$.

Задача

Задача состоит в описании свойств семейства распределений $\xi_{I,E}$ и проверке гипотез о

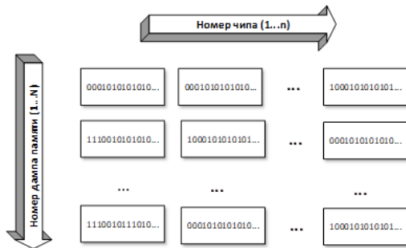
- Уникальности, $\forall I \neq I^* \xi_{I,E} \neq \xi_{I^*,E}$

А для конкретного семейства распределений $\xi_{I,*}$ проверке гипотез о

- Стабильности, $\forall E \neq E^* \xi_{I,E} = \xi_{I,E^*}$, в том числе конкретных битов: $P(\xi_{I,*}(x) = a) = 1, a = 0, 1$
- Случайности конкретных битов, $P(\xi_{I,*}(x) = a) = 1/2, a = 0, 1$

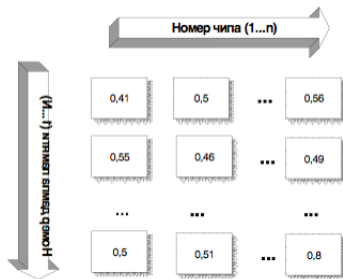
Такие характеристики рассматриваются в ISO/IEC 20897-1:2020 Information security, cybersecurity and privacy protection — Physically unclonable functions — Part 1: Security requirements

- Количество чипов – $n = 20$
- размер дампа памяти – $l = 262144$ бита
- температура окружающей среды – $+20; +85$
- входное напряжение – $2.7, 3.3, 3.6$ V
- общее количество дампов памяти для каждого устройства и на каждый набор условий – $N = 500$



Среднее арифметическое значение ячеек памяти среди набора дампов памяти одной ФНФ (случайность)

- Для каждого дампа вычислить среднее значение
$$w(k, j) = \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j x_i^{k,j}, k = 1, \dots, n, j = 1, \dots, N$$
- Вычислить среднее для каждого столбца
$$w(k) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w(k, j)$$
- В предположении о случайности и равновероятности битов в дампах проверить принадлежность значения интервалу, определяемом правилом «3-х сигм»



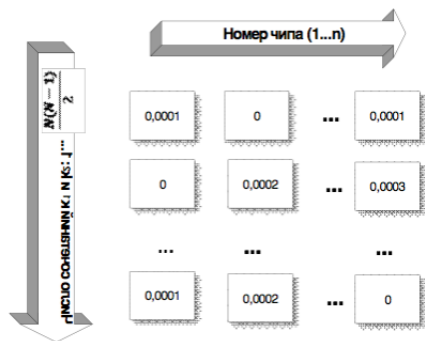
Внутреннее расстояние между ячейками памяти среди набора дампов памяти одной ФНФ (случайность)

Номер чипа	Выборочное среднее и выборочная дисперсия		
	V=2,7B	V=3,3B	V=3,6B
1	0.50146072 0.000000092118	0.50150923 0.000000087895	0.50137165 0.000000084968
2	0.50071073 0.000000060286	0.50064802 0.000000056856	0.50061232 0.000000055518
3	0.49884998 0.000000066712	0.49884940 0.000000066384	0.49874670 0.000000063403
4	0.49560645 0.000000074413	0.49564218 0.000000081667	0.49584036 0.000000065499

Результат слабо зависит от напряжения и температуры (стабильность)

Внутреннее расстояние между ячейками памяти среди набора дампов памяти одной ФНФ (уникальность)

- Для каждого чипа вычислить значения
$$v(k, j_1, j_2) = \frac{\|x_i^{k, j_1} \oplus x_i^{k, j_2}\|}{I}, k = 1, \dots, n, j_1, j_2 = 1, \dots, N$$
 и записать их в таблицу
- Вычислить среднее для каждого столбца $w_v(k) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N(N-1)/2} v(k, j_1, j_2)$
- Проверить по правилу «3-х сигм»



Внутреннее расстояние между ячейками памяти среди набора дампов памяти одной ФНФ (уникальность)

Номер чипа	Внутренние расстояния: выборочное среднее и выборочная дисперсия		
	V=2,7B	V=3,3B	V=3,6B
1	0.05906259	0.05447963	0.06518235
	0.000002281870	0.000003854626	0.000003293177
2	0.05918106	0.05741587	0.04953285
	0.000001566328	0.000002626647	0.000007457934
3	0.04879665	0.05643666	0.06154798
	0.000006580269	0.000003256706	0.000002290288

Рис.: $t = 20$

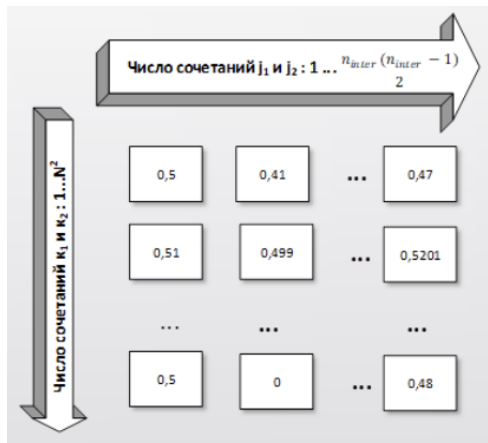
Номер чипа	Внутренние расстояния: выборочное среднее и выборочная дисперсия		
	V=2,7B	V=3,3B	V=3,6B
1	0.04627226	0.04688653	0.04549836
	0.000000808308	0.000001419718	0.000000622746
2	0.03043424	0.03034042	0.03081065
	0.000000495024	0.000000690844	0.000000546972
3	0.03260373	0.03302181	0.03350127
	0.000000508577	0.000000845546	0.000000506031
4	0.03778450	0.03803549	0.03872527
	0.000000963293	0.000001376060	0.000000923761

Рис.: $t = 85$

Результат значимо зависит от внешних условий (нестабильность)

Внешнее расстояние между ячейками дампов памяти различных ФНФ (уникальность)

- Для каждого чипа вычислить значения $ex(k_1, k_2, j_1, j_2) = \frac{\|x_i^{k_1 \cdot j_1} \oplus x_i^{k_2 \cdot j_2}\|}{l}$, $k_1, k_2 = 1, \dots, n, j_1, j_2 = 1, \dots, N$ и записать их в таблицу
- Вычислить среднее для каждого столбца $w_{ex}(j_1, j_2) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N^2} ex(k_1, k_2, j_1, j_2)$
- Проверить по правилу «3-х сигм»



Внешнее расстояние между ячейками дампов памяти различных ФНФ (уникальность)

Номера чипов	Внешнее расстояние: выборочное среднее и выборочная дисперсия		
	V=2,7В	V=3,3В	V=3,6В
1,2	0.4633703075 0.000000152145	0.4631401058 0.000000137501	0.4635545975 0.000000142796
1,3	0.4577461754 0.000000133674	0.4577085335 0.000000155281	0.4578909628 0.000000146274
1,4	0.4670000881 0.000000138238	0.4670570770 0.000000152303	0.4670326313 0.000000141687
2,3	0.3785835445 0.000000111257	0.3786007230 0.000000120847	0.3782223327 0.000000129675
2,4	0.4859901595 0.000000128478	0.4860412492 0.000000124481	0.4862277456 0.000000128079
3,4	0.4764103460 0.000000133213	0.4764334323 0.000000146427	0.4767964090 0.000000141825

Рис.: $t = 20$

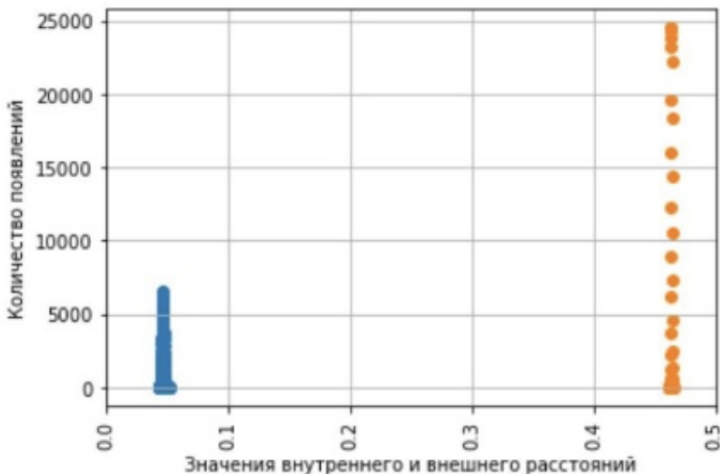
Номера чипов	Внешнее расстояние: выборочное среднее и выборочная дисперсия		
	V=2,7В	V=3,3В	V=3,6В
1,2	0.4545829845 0.000000206244	0.4547041212 0.000000213804	0.4542667564 0.000000207752
1,3	0.4508166418 0.000000212451	0.4513289223 0.000000198740	0.4513080935 0.000000234680
2,3	0.4170767057 0.000000321377	0.4176572246 0.000000348043	0.4169089552 0.000000467793

Рис.: $t = 85$

Результат значимо зависит от внешних условий (нестабильность)

Уникальность

Внешнее и внутреннее расстояние позволяет эффективно различать последовательности, полученные от одного и разных чипов (даже при изменяющихся условиях – все-таки стабильность)



- в исходной матрице w ищем биты (почти) константные – это стабильные биты (такие есть)
- удаляем стабильные биты
- для каждого набора параметров анализируем последовательности с помощью критериев согласия из набора статистических критериев

- пересекающиеся 3,4,5-граммы
- ранг матриц
- серий
- случайное блуждание
- непопадания в заданный диапазон (6 вариантов)
- стопка книг
- монотонности

Чип	Напряжение	Тест 1	Тест 2	Тест 3	Тест 4	Тест 5	Тест 6	Тест 7	Тест 8	Тест 9	Тест 10	Тест 11	Тест 12	Тест 13	Тест 14
1	27	0.84	0.97	0.70	0.96	1.00	0.00	0.65	0.36	0.88	0.92	0.94	0.98	0.96	0.93
	33	0.98	0.83	0.83	0.95	1.00	0.00	0.31	0.67	0.43	0.85	0.98	1.00	0.94	0.93
	36	0.97	0.93	0.50	0.96	1.00	0.00	0.36	0.64	0.89	0.75	0.97	1.00	0.92	0.94
2	27	0.92	0.97	0.91	0.97	1.00	1.00	0.94	0.94	0.97	0.98	0.99	1.00	0.96	0.90
	33	0.96	0.93	0.94	0.96	1.00	0.99	0.97	0.98	0.97	0.96	0.98	1.00	0.97	0.96
	36	0.61	0.98	0.90	0.95	1.00	1.00	0.97	0.93	0.99	0.92	0.96	1.00	0.97	0.92
3	27	0.96	0.97	0.90	0.97	1.00	1.00	0.97	0.97	0.98	0.99	0.99	1.00	0.93	0.95
	33	0.99	0.87	0.95	0.96	1.00	0.99	0.98	0.95	0.98	0.88	0.98	0.99	0.97	0.94
	36	0.92	0.98	0.70	0.97	1.00	0.99	0.90	0.73	0.98	0.97	0.99	1.00	0.98	0.96
4	27	0.89	0.94	0.83	0.93	1.00	1.00	0.91	0.97	0.99	0.91	0.98	1.00	0.98	0.95
	33	0.96	0.93	0.95	0.96	1.00	0.99	0.93	0.94	0.99	0.97	0.99	1.00	0.97	0.95
	36	0.96	0.99	0.72	0.97	1.00	1.00	0.92	0.98	0.99	0.96	1.00	1.00	0.96	0.98

Задача проверки случайности требует более глубокого исследования

- Предложена теоретико-вероятностная формализация задачи оценки характеристик ФНФ
- Предложен статистический эксперимент по оценке характеристик ФНФ
- Для ФНФ типа SRAM данный эксперимент позволил
 - Подтвердить гипотезу об уникальности
 - Показать зависимость значений некоторых характеристик от внешних параметров
 - Позволил выявить стабильные биты
 - Не позволил подтвердить гипотезу о случайности оставшихся битов